

## บทที่ 1

### บทนำ

หัวตรวจจับก๊าซ หรือ หัววัดก๊าซ (gas sensor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความเข้มข้นของก๊าซหรือไอของสารเคมี เพื่อใช้ในการตรวจคุณลักษณะในอากาศ ควบคุมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงหรือใช้งานในการควบคุมปริมาณของก๊าซในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสารเคมี โดยการวัดความเข้มข้นของก๊าซจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางกายภาพของตัวตรวจวัดซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซ เช่น ความด้านทานไฟฟ้า และ ความต่างศักย์ไฟฟ้า สารที่นำมาทำเป็นตัวตรวจวัดนั้นจะต้องมีการตอบสนองกับก๊าซสูงเพียงพอที่จะแยกแยะความเข้มข้นของก๊าซได้

โมลิบดีนัมไครอโอกไซด์ ( $\text{MoO}_3$ ) เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดແಡบพลังงานกว้าง (wide-band gap semiconductor)<sup>(1)</sup> ในปัจจุบันได้มีการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในหลายปฏิกิริยา เช่น ปฏิกิริยาลดกำมะถันออกจากปิโตรเลียม<sup>(2)</sup> ใช้ทำอุปกรณ์ทางแสง<sup>(3)</sup> และใช้เป็นหัววัดก๊าซได้<sup>(4-5)</sup>

#### 1.1 ชนิดของหัววัดก๊าซ<sup>(6)</sup>

การจำแนกชนิดของหัววัดก๊าชนั้นจำแนกได้จากชนิดของตัวแปรทางกายภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการตอบสนองกับก๊าซดังตารางที่ 1.1

**ตารางที่ 1.1 แสดงการจำแนกชนิดของหัววัดกําชตามชนิดของตัวแปรทางกายภาพ  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการตอบสนองกับกําช**

ชนิดของหัววัดกําช	ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลง	ตัวอย่าง
Conductometry	สภาพนำ หรือ สภาพด้านท่านไฟฟ้า	Tin oxide gas sensor
Potentiometry	ความต่างศักย์ไฟฟ้า	Zirconia sensor
Amperometry	กระแสไฟฟ้า	Electrochemical cell
Calorimetry	ความร้อนจากการเผาไหม้	Pellistor based sensor
Optical	path length/absorption	Infrared detector of CH <sub>4</sub>

**1.2 วัตถุที่นำมาทำเป็นตัวตรวจวัดกําช <sup>(๑)</sup>**

วัตถุที่นำมาใช้เป็นตัวตรวจวัดกําชอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางกายภาพได้หลายแบบ เช่น

- 1) Liquid state electrolyte sensor เช่น สารละลายนครค หรือ เกลือ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพนำ หรือ สภาพด้านท่านไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และ กระแสไฟฟ้า เมื่อมีการตอบสนองกับกําช
- 2) Solid state electrolyte sensor เช่น λ-probe ที่ใช้สาร ZrO<sub>2</sub>(Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) เป็นตัวตรวจวัด ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงของ ความต่างศักย์ไฟฟ้า และ กระแสไฟฟ้า เมื่อมีการตอบสนองกับกําช
- 3) Electronic conductance and Capacitance sensor เช่น สารประกอบโลหะออกไซด์ จะมีการเปลี่ยนแปลงของ สภาพนำไฟฟ้า และ ความจุประจุไฟฟ้า เมื่อได้รับกําช
- 4) Field effect sensor เป็น Field effect transistor (FET) ที่ทำงานกับวัตถุที่มีการตอบสนองกับกําช จะมีการเปลี่ยนแปลงของ ความต่างศักย์ไฟฟ้า, work function
- 5) Optochemical and photometric sensor เช่น แสงเลเซอร์ จะมีการเปลี่ยนแปลงของ ความเข้มแสง ความยาวคลื่น และ optical constant

### 1.3 ประวัติความเป็นมา

ได้มีการวิเคราะห์สมบูดิการตรวจวัดกําชของสาร เช่น สารประกอบโลหะออกไซด์ และสารละลายน้ำที่มีอยู่ในโลหะอิเล็กโทรไลท์ เพื่อนำมาใช้เป็นตัวตรวจวัดกําชดังนี้

ในปี ค.ศ.1888 W. Nernst<sup>(7)</sup> ได้ทำหัววัดกําชแบบ potentiometry โดยทำมาจากข้าวโลหะที่เชื่อมต่ออยู่ในสารละลายน้ำของตัวมันเองซึ่งสารละลายน้ำจะเป็นตัวตรวจจับและทำปฏิกิริยาคุณลักษณะ แต่แยกตัวเป็นอิออนมากขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักยไฟฟ้าระหว่างข้าวโลหะและเยาสามารถสร้างสมการเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักยไฟฟ้าและความเข้มข้นของกําช เรียกว่า สมการ Nernst

ในปี ค.ศ. 1904 บริษัท MAN<sup>(8)</sup> ได้ทำหัววัดกําชชนิด resistance sensor โดยมีลักษณะเป็นสายไฟที่ร้อนจัดเมื่อเกิดปฏิกิริยาคุณลักษณะที่ทำให้สภาพด้านทานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป

ในปี ค.ศ.1923 Jonson<sup>(9)</sup> ได้ทำหัววัดกําชชนิด calorimetry ซึ่งเป็นหัววัดกําชที่ใช้กับกําชที่เผาไหม้ได้ โดยจะให้ความร้อนแก่กําชชนิดการเผาไหม้แล้ววัดความเข้มข้นของกําชาด้วยความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของกําช

ในปี ค.ศ. 1962 Seiyama Taguchi<sup>(10)</sup> ได้ค้นพบและเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ หัววัดกําชที่ทำด้วยสารกึ่งตัวนำประเภทสารประกอบออกไซด์ว่า กระบวนการตรวจวัดกําชจะเกิดที่บริเวณ oxygen vacancy ใน grain boundary ซึ่งเป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของผลึกของตัวซึ่นหรือ เมื่อสารประกอบโลหะออกไซด์มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้เกิดการยึดติดของออกซิเจนในอากาศตรงบริเวณ grain boundary และเมื่อมีกําชเข้ามา กําชจะทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือ ปฏิกิริยารีดักชันกับออกซิเจนที่ยึดติดและเกิดการคุณลักษณะและปลดปล่อยอิเล็กตรอนทำให้ความด้านทานไฟฟ้าของสารประกอบโลหะออกไซด์เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มข้นของกําช

หลังจากนั้นมาสารกึ่งตัวนำประเภทออกไซด์ได้ถูกนำมาศึกษาเพื่อใช้เป็นหัวตรวจวัดกําชอิกหอยรูปแบบ เช่น

ในปี ค.ศ. 1989 M. Egashira และคณะ<sup>(10)</sup> ได้ทำการปฏิกริยาสเกอร์ ZnO โดยวิธี Vapor phase reaction โดยการ ออกซิเดชัน พง ZnO ที่ผสานกับผงคาร์บอนในบรรยายกาศของอากาศที่มีอัตราการ ไนต์ 10 ml/min ที่อุณหภูมิ 950 °C แล้วนำไปวัดการตอบสนองทางไฟฟ้ากับก้าช คาร์บอนอนอนออกไซด์ก้าชไฮโตรเจน และ ก้าชนีเทน พบว่าสภาพไว(อัตราส่วนระหว่างความต้านทานเริ่มต้น ต่อ ความต้านทานเมื่อได้รับก้าช) อยู่ระหว่าง 1-1.1 แต่เมื่อเติมธาตุลิเทียมเป็นสารเชื้อลง ไปทำให้สภาพไวเพิ่มเป็น 1-4

ในปี ค.ศ.1998 M. Di Giulio และคณะ<sup>(11)</sup> ได้ทำการวิจัยเตรียมพิล์มนบาง MoO<sub>3</sub> เพื่อใช้ในการ ตรวจจับก้าชในไครเจนนอนออกไซด์ นำพิล์มนบางที่เตรียมได้ไปหาค่า Energy gap โดยใช้วิธีตรวจ สอบสมบัติการส่งผ่านและถูกกลืนแสงในย่าน NIR-UV พบว่า MoO<sub>3</sub> มี Energy gap ประมาณ 2.89 eV และได้ทำการตรวจสอบสมบัติการตรวจวัดก้าชในไครเจนนอนออกไซด์ที่อุณหภูมิ 200 °C โดย แบร์ค่าความเข้มข้นของก้าชพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพไวและความเข้มข้นของก้าชเป็น แบบเชิงเส้น

ในปี ค.ศ.1999 E. Comini และคณะ<sup>(12)</sup> ได้ทำการเตรียมพิล์มนบาง MoO<sub>3</sub> จากเป้าโนลิบดีนัม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วที่มีความบริสุทธิ์ 99.95% ลงบนแผ่นอลูминิในบรรยายกาศผสมระหว่าง ก้าชอาร์กอนและออกซิเจน โดยใช้วิธี RF sputtering ให้ความหนาประมาณ 600 nm แล้วทำข้าไฟฟ้า คัวชการ sputtering ทองแดงทับบนแผ่นพิล์มนบาง MoO<sub>3</sub> บางส่วนให้ได้ความหนาประมาณ 200 nm. แล้วนำไปตรวจสอบสมบัติการตรวจวัดก้าชกับก้าชออกซิเจนที่มีความเข้มข้น 100 ppm โดยที่แบร์ ค่าอุณหภูมิของระบบจาก 250-500 °C ปรากฏว่าสภาพไวของพิล์มนบางมีค่าเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิและ ได้ตรวจสอบสมบัติการตรวจวัดก้าชกับก้าชคาร์บอนนอนออกไซด์ที่อุณหภูมิ 300°C ปรากฏว่าสภาพ ไวของพิล์มนบางเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของก้าชแบบเชิงเส้น

ในปี ค.ศ.2001 Cuk Imawan และคณะ<sup>(13)</sup> ได้เตรียมพิล์มนบาง MoO<sub>3</sub> 10 ชั้นลงบน SiO<sub>2</sub> โดย ใช้วิธี RF sputtering จากเป้าโนลิบดีนัมเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 cm. ที่มีความบริสุทธิ์ 99.95% ใน บรรยายกาศผสมที่เกิดจากการปล่อยก้าชาร์กอนในอัตรา 80 cc/min และก้าชออกซิเจนในอัตรา 20 cm<sup>3</sup>/min ความคัน 0.009 mbar โดยใช้กำลังไฟฟ้า 350 W สำหรับชั้นแรก และ 750 W สำหรับชั้นที่ 2-10 ให้ได้ความหนาโดยรวมประมาณ 450 nm แล้วจึงนำพิล์มนบางที่ได้ไป annealing ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 ชั่วโมง และทำข้าไฟฟ้าโดยใช้ Pt-IDC structure แล้วทำการตรวจ

สอบสวนบัตการตรวจวัดก้าชฟิล์มนบางที่เตรียมได้โดยใช้ก้าชไฮโครเจนและก้าชแอมโมเนียประกอบกัน ไม่นี้ยังคงกว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของก้าชกับสภาพการตอบสนองเป็นแบบเชิงเส้น

สำหรับการปัจจุบันหลักเชิงเดียว และ วิสเกอร์ ของ  $\text{MoO}_3$  นี้มีประวัติความเป็นมาดังนี้

ในปี ก.ศ. 1999 H.C. Zeng<sup>(2)</sup> ได้ปัจจุบันหลัก  $\text{MoO}_3$  ได้เป็นครั้งแรกโดยใช้วิธี wall-heated sublimation เพื่อให้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีในการกำจัดกำมะถันในปี โคลเลียม ภายใต้ท่อควบคุมที่ใช้เตาไฟฟ้าแบบตั้ง เมื่อตรวจสอบโครงสร้าง โดยวิธี XRD พบว่ามีการเดี่ยวเบนของรังสีเอกซ์จากมุตระนาบของหลัก ( $0k0$ ) โดยที่  $k = 2,4,6$  มากกว่า ระนาบ ( $011$ ) และ ( $021$ ) และวิสเกอร์งอกในทิศทาง ( $001$ )

การเตรียมวิสเกอร์  $\text{MoO}_3$  นี้สำเร็จเป็นครั้งแรกในปี ก.ศ. 2002 โดย Li Jianqiang และ คุณะ<sup>(11)</sup> ได้เตรียมวิสเกอร์  $\text{MoO}_3$  จากการ oxidation เส้นใยไมโลนิตินที่อุณหภูมิ 973, 1023 และ 1173 K พบร่วมวิสเกอร์มี prefer orientation ในทิศทาง ( $0k0$ ) โดยที่  $k = 2,4,6$  และวิสเกอร์งอกในทิศทาง ( $001$ )

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการวิจัยนี้ จะหาเงื่อนไขในการเตรียมวิสเกอร์  $\text{MoO}_3$  เพื่อให้ได้วิสเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับสร้างเป็นหัววัดก้าชเพื่อใช้ในการตรวจจับ ไอของเอชิลแอลกอฮอล์ และ ไอของอะซีโตน โดยการหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้หัววัดในการตรวจจับ ไอของเอชิลแอลกอฮอล์ และ ไอของอะซีโตน และหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพไวกับความเข้มข้นของ ไอของเอชิลแอลกอฮอล์ และ ไอของอะซีโตน